

## 、波导波长的测量 1) 实验内容 【方法一】两点法: 微波 选频 信号源 放大器 检波晶体 隔离器 波长表 可变衰减器 测量线 短路片 波导波长测量系统框图 图1

负载可接可变电抗或短路片,可变电抗和短路片的反射系数的模值接近**1**,在测量线中入射波与反射波的叠加为接近纯驻波的图形,只要测得驻波相邻节点的位置 $T_1$ 、 $T_2$ ,由  $\frac{1}{2}\lambda_g = T_2 - T_1$ ,即可求得波导波长  $\lambda g$ 。



## 两点法确定波节点位置

为了做到准确测量通常用两点法来确定波节点的位置,即测量波节点附近两边指示电表读数相等的两点 $T_1$ 和 $T_2$ ,如图**2**所示。

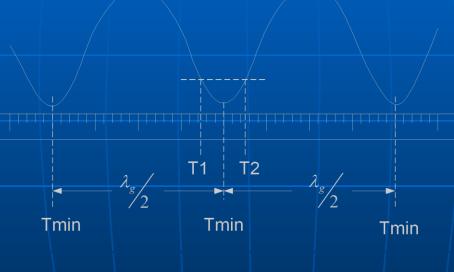


图2 两点法确定波节点位置示意图



## 波节点的位置 $T_{\min}$ 取 $T_1$ 和 $T_2$ 的平均值

$$T_{\min} = \frac{T_1 + T_2}{2}$$
 (1a)

由图2可知,波导波长

$$\lambda_g = 2|T'_{\min} - T_{\min}| \qquad \qquad \textbf{(1b)}$$

同样,可以由波导波长,利用(3)式计算出信号波长。

$$\lambda_g = \frac{\lambda_o}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_o}{2a}\right)^2}} \tag{3}$$



## 【方法2】间接法

理论上, 自由波长  $\lambda_o$  和频率 f 的换算方法:

$$\lambda_o = \frac{c}{f} \tag{2}$$

c为自由空间波传播速度,约 3×10<sup>10</sup> 厘米/秒

对于矩形波导中的  $H_{10}$ 波,自由空间波长  $\lambda_o$  和波导波长 $\lambda_g$  满足公

式:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_o}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_o}{2a}\right)^2}} \tag{3}$$

a为矩形波导宽边尺寸,对三厘米波导a=22.86毫米。

上个实验已经用波长表测量出信号波长,利用(3)式,再计算  $\lambda_g$ 。

注意:利用波长表进行波导波长测量要注意,测量信号波长完成后要将波长计从谐振点调开,以免信号衰减影响后面的测量。



二、校准晶体二极管检波器的检波特性

## 1) 实验原理

微波测量中,为指示波导(或同轴线)中电磁场强度的大小,是将它经过晶体二极管检波变成低频信号或直流电流,用直流电表的电流I来读数的。从波导宽壁中点耦合出两宽壁间的感应电压,经微波二极管进行检波,调节其短路活塞位置,可使检波管处于微波的波腹点,以获得最高的检波效率。

晶体二极管是一种非线性元件,亦即检波电流I同场强E 之间不是线性关系,通常表示为:

$$I = kE^n$$

**(4)** 



 $I = kE^n$ 

(4)

其中k,n是和晶体二极管工作状态有关的参量。

 $y_n=1$ ,  $I \propto E$  称为直线律检波,

当n=2,  $I \propto E^2$ 称为平方律检波。

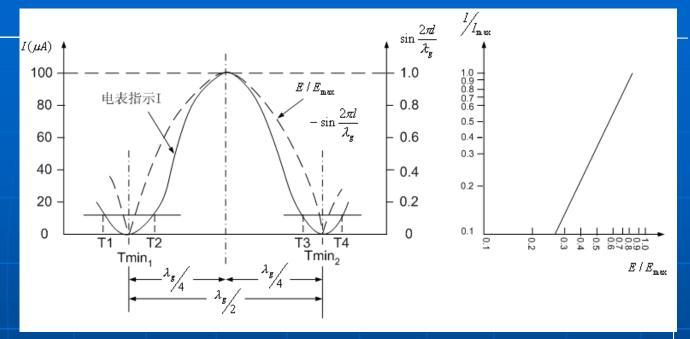
当微波场强较大时呈现直线律,当微波场强较小(P < 1µW)时呈现平方律。处在大信号和小信号两者之间,检波律n就不是整数。

因此,当微波功率变化大时,n和K就不是常数,所以 在精密测量中必须对晶体检波器进行校准。

晶体检波器校准方法主要是驻波法,驻波法通常有两种。



#### 第一种定标方法



3a 检波电流、相对场强和位置的关系 3b 对数坐标下的定标曲线 83 检波晶体特性校准

将测量线终端短路,仔细调谐好检波腔,测出场沿线分布的检波电流I,作出如图3中的实线图形。由于测量线终端短路,电场强度沿线按正弦规律分布,如图3a中虚线所示,可在场图上画出实际场强分布:

$$E' = E / E_{\text{max}} = \sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g}) \tag{5}$$

其中,l是探针距波节点的距离, $\lambda_g$ 是波导波长。



#### 第一种定标方法

将 (5) 式 
$$E' = E / E_{\text{max}} = \sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})$$

带入(4)式 
$$I = kE^n$$
,可以得到:

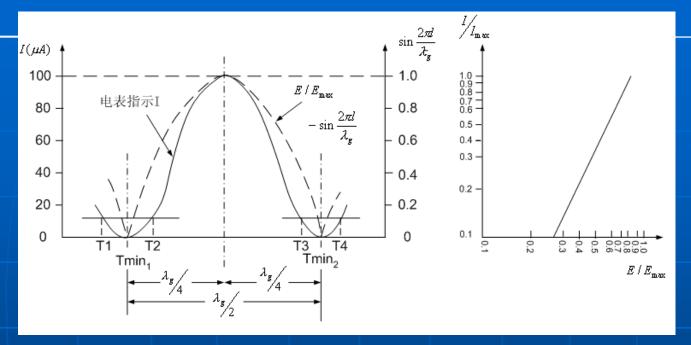
$$I = k' |\sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})|^n$$

(6)

式中, 
$$k$$

$$k' = kE_{\text{max}}^n$$



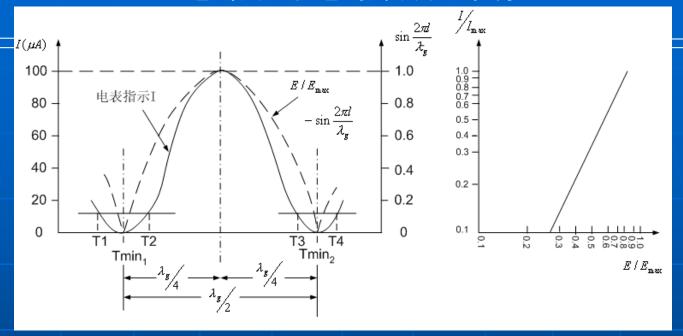


3a 检波电流、相对场强和位置的关系 3b 对数坐标下的定标曲线 图3 检波晶体特性校准

 $|\sin(\frac{2\pi l}{\lambda_{\sigma}})|$ 

图3a中的虚线为 $E/E_{max}$ 与位置的关系。图3a中的实线为归一化检波电流  $I/I_{max} = f(E/E_{max})$  与位置的关系。在  $\lambda g/4$  范围内,移动探针,选取场强的相对值  $\sin(\frac{2\pi I}{\lambda})$  为0.1,0.2,0.3,.....1.0时的位置处,读取I做出的曲线,是晶体二极管的定标曲线,为图3a中的实线所示。





3a 检波电流、相对场强和位置的关系 3b 对数坐标下的定标曲线 图3 检波晶体特性校准

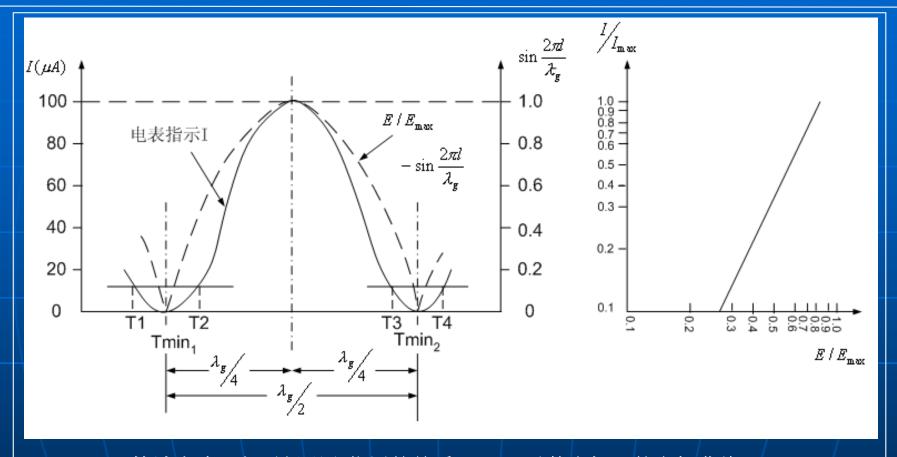
 $|\sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})|$ 

如果对(6)式  $I = k' | \sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})|^n$  左右两边取对数,

并令 
$$k'=1$$
 ,得到: 
$$\log I = n\log|\sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})| = n\log(E/E_{\text{max}})$$
 (7)

如将 $\mathbf{I}$ 和 $|\sin(\frac{2\pi l}{\lambda_s})|$ ,画在全对数坐标纸上,连成平滑曲线如图 $\mathbf{3b}$ 所示,该曲线斜率即为晶体检波率 $\mathbf{n}$ 。





3a 检波电流、相对场强和位置的关系 3b 对数坐标下的定标曲线 图3 检波晶体特性校准



### 第二种定标方法

测量线终端短路,测出半峰值读数间的距离W,即测量测量线上检波电流对峰值电流为0.5时两个等指示度之间的距离W,晶体检波律n可以根据下式计算:

$$n = \frac{\log 0.5}{\log \cos \left(\frac{\pi W}{\lambda_g}\right)}$$
 (8)



实验室内大多数微波测试系统是属于小信号工作状态,因此,晶体 检波律近似为平方律,取**n=2**。

需要指出:晶体二极管的定标曲线和检波率随时间、温度、湿度变化较大、校准工作要经常进行。晶体检波器校准曲线在测量驻波系数时极为重要,因为驻波系数的定义是  $\rho = \frac{|E|_{\max}}{|E|}$  而在小信号平方律检波时

$$\rho = \frac{|E|_{\text{max}}}{|E|_{\text{min}}} = \frac{\sqrt{I_{\text{max}}/k}}{\sqrt{I_{\text{min}}/k}} = \sqrt{\frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}}} = \sqrt{\frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}}}$$
(9)

故驻波系数的测量转化为晶体检波电流的测量。



# 2) 实验步骤

$$E / E_{\text{max}} = \sin(\frac{2\pi l}{\lambda_g})$$

所测量的波导波长: 波节点 1, 的位置:											
相 对 电场强度	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
l (理论 计算公 式)	0	$\lambda_g$ / 63	$\frac{\lambda_g}{31.3}$	$\frac{\lambda_g}{20.6}$	$\frac{\lambda_g}{15.3}$	$\frac{\lambda_g}{12}$	$\frac{\lambda_g}{9.8}$	$\frac{\lambda_g}{8.1}$	$\frac{\lambda_g}{6.8}$	$\frac{\lambda_g}{5.6}$	$\frac{\lambda_g}{4}$
<i>l</i> (理论 值)											
测量点 实际位 置 <i>l<sub>0</sub>+l</i>											
U					_		_			_	